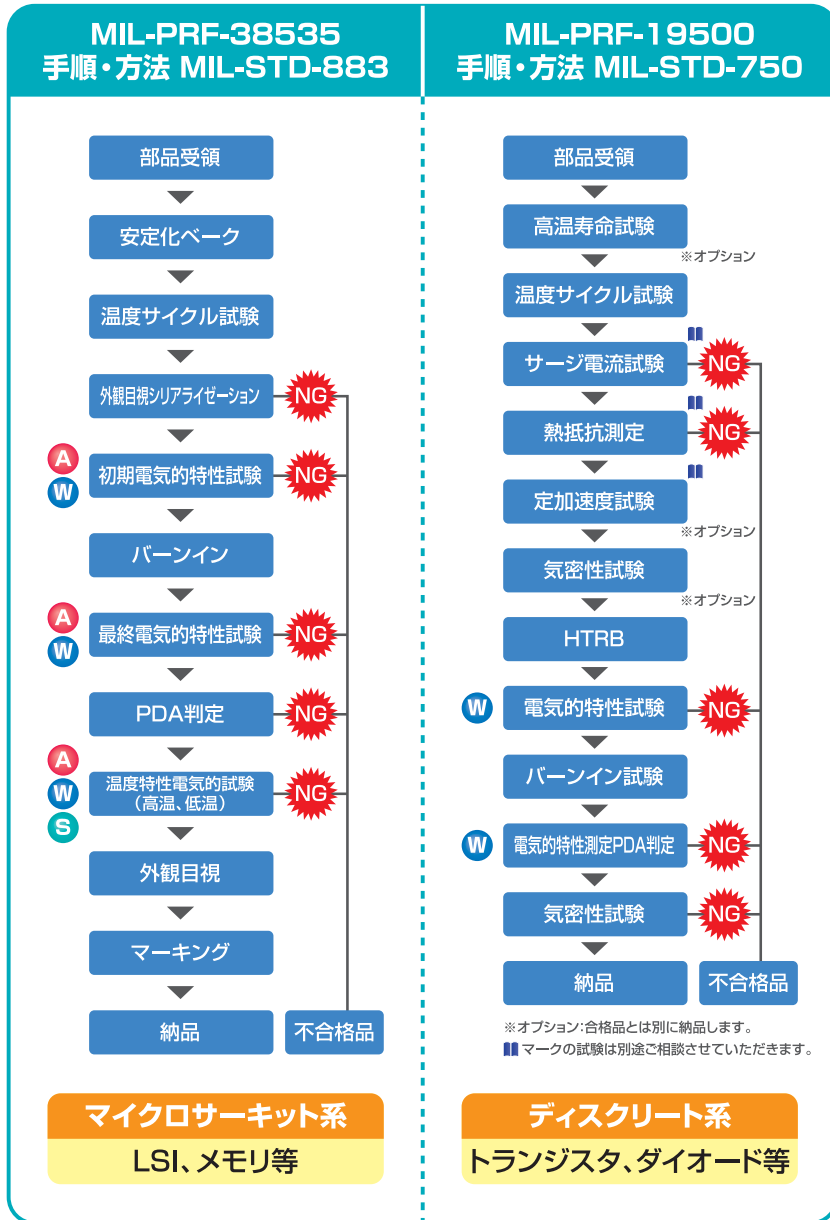


半導体デバイスのスクリーニング

LSIから、単純なディスクリート品まで、全ての電子部品に
宇宙・航空分野で培った、ハイグレードなスクリーニング技術を役立てます。



使用テスト例



SoCテスト T6575
ウェハプローバ P-12XL



リニアテスト WTS700



温度印加測定
(-55℃～+150℃) T2500

弊社をご利用いただく利点

- ・多品種への対応実績
- ・IECQ独立試験所認定
- ・ボード製作から結果判定までワンストップでご提供
- ・30年に渡る、豊富な経験
- ・公正・中立なデータ提供
- ・経験に基づく技術
- ・厳重な機密保持

デバイス、数量、条件の情報をご提示いただければ、最適な費用/納期をご提案いたします。